

第7回 放射線による非破壊評価シンポジウム

主催：(社)日本非破壊検査協会 放射線分科会

協賛：関連学協会

期日：平成22年3月4日(木) 10:30~17:20
3月5日(金) 10:30~15:55

会場：機械振興会館 6階66号室
東京都港区芝公園3-5-8 TEL 03-3434-8216
(次頁案内図参照)

参加費：放射線分科会委員及び登壇者 無料(論文集1冊を含む)
上記以外の方 5,000円(論文集1冊を含む)
*参加費は、当日受付にてお支払い下さい。

懇親会：平成22年3月4日(木) 17:00~19:00
*会費：3,000円は、当日受付にてお支払い下さい。

問合先：(社)日本非破壊検査協会 放射線シンポジウム 係
TEL 03-5821-5105 FAX 03-3863-6524
Email:gamou@jsndi.or.jp

3-1 JIS Z 4560 原案作成について

ポニー工業(株) ○釜田敏光

3-2 デジタルラジオグラフィ法適用のための規格化への取組み

(社)日本溶接協会○大岡紀一
富士フィルム(株)窪田 聡

3-3 CRおよびデジタイザーに関する規格の紹介

富士フィルム(株)窪田 聡
(社)日本溶接協会 大岡紀一

懇親会

(18:00~20:00)

第2日 3月5日(金)

10:30~15:55

(10:30~12:00)

座長 齊藤泰司(京都大学)

4-1 最新の技術を駆使した「高性能ポータブルX線装置」の開発

トーレック(株) ○千葉兼嗣、白杵辰己
美濃部光正、佐藤公悦

4-2 新しいガンマ線透過試験装置の紹介

ポニー工業(株) ○釜田敏光

4-3 第3世代X線検出器『SID-A 50』

ポニー工業(株) ○高田圭弘、中井啓介、釜田敏光

昼休み(12:00~13:00)

(13:00~14:30)

座長 岡本賢一(京都大学)

5-1 微弱電子線の直接照射によるウラン・トリウムの高感度非破壊分析法

大阪府立大学 ○佐々木遼也、谷口良一
奥田修一、小嶋崇夫

5-2 マイクロフォーカスX線CTによるマグネシウム合金スタッド溶接部のボイド計測

福岡県工業技術センター ○糸平圭一、貝田博英、内野正和
熊本大学 森 和也、山口晃生

5-3 中性子ラジオグラフィを用いた液体金属流れの計測

京都大学原子炉実験所 ○齊藤泰司

休憩(14:30~14:45)

(14:45~15:45)

座長 脇部康彦(新日本非破壊検査(株))

6-1 測定値から見る放射線測定器の性能

(第2報 測定値のバラツキと応答性)

非破壊検査(株) ○藪下延樹
(財)電子科学研究所 辻本 忠

6-2 冷却型CCDの放射線損傷

大阪府立大学○谷口良一、佐々木遼也、奥田修一
京都大学原子炉実験所 岡本賢一

近畿大学 小川喜弘

(財)電子科学研究所 辻本 忠

閉会挨拶

(15:45~15:55)

放射線シンポジウム実行委員長

(注) 座長及び講演日時は、変更される場合があります。

プログラム

発表時間 一般： 講演25分 質疑5分

第1日 3月4日(木) 10:30~17:20

開会挨拶 (10:30~10:40)
放射線分科会主査 加藤 潔 (日本X線検査)

(10:40~12:10)

座長 谷口良一(大阪府立大学)

1-1 高速応答X線センサと高速度カメラを用いた高速度X線透視技術

東芝ITコントロールシステム(株)
○小島光法、富澤雅美、小湊 宏、水口量之

1-2 デジタルフラットパネルディテクタの製品紹介

ポニー工業(株) ○石川 剛、藤本真也

1-3 フィルムデジタイザの方式について

アレイ(株) ○稲見 隆

昼休み(12:10~13:30)

(13:30~15:30)

座長 加藤 潔 (日本X線検査)

2-1 工業用X線装置を利用した配管劣化診断技術

(株)ジャスコ ○松本 章

2-2 X線ラインセンサによる配管検査の基礎検討

新日本非破壊検査(株)○脇部康彦
浅野裕一、松山久之、新家祥之

2-3 原子カプラント機器へのCR(Computed Radiography)の適用状況について

三菱重工業(株)○長谷部貴士、得能清秋
玉井伸樹、小林啓太、吉谷 晶

2-4 IPの長時間露光特性の検討

大阪府立大学 ○谷口良一、佐々木遼也
奥田修一、小嶋崇夫

休憩(15:30~15:50)

(15:50~17:20)

座長 藤岡和俊 ((財)発電設備技術検査協会)

会場案内図

